高運動量二次粒子ビームライン(π20)へ向けたテスト実験

1. ハドロンの分光研究

J-PARC ハドロン実験施設では物質の起源と進化の解明を目指し、フレーバー物理やハドロン物理、 ストレンジネス核物理といった様々な階層に渡る研究を推進している。その柱の1つであるハドロ ン物理の目標は、物質の素になっている素粒子(クォーク・グルーオン)から、どのようにハドロンが 作られているかを解明することである。ハドロンはクォークや反クォーク、グルーオンが強い相互 作用で結合した粒子の総称である。ハドロンはクォーク 3 つからなるバリオンと、クォークと反ク オークからなるメソン(中間子)に大別される。クォークはハドロン内部に閉じ込められていて単独で 取り出せないため、ハドロン内部のクォークの振る舞いを知るには、ハドロンをエネルギーの最も 低い状態(基底状態)から励起させて、その励起状態の性質を調べるハドロン分光の手法を用いる。ハ ドロンの基底・励起状態の性質には系統性を見出すことができ、その内部構造を記述する有効な内 部自由度の存在が示唆されている。励起状態の研究の進展によって、クォークの数が4つや5つか らなる状態と示唆される新発見のハドロンが多数発見されている[1-2]が、それらの励起構造を創り 出す内部のクォークの振る舞いの解明が課題となっている。ハドロンの内部構造の解明を目指し、 我々は J-PARC の大強度ハドロンビームを用いた分光実験を推進している。

ハドロン励起構造を創り出す内部のクォークの振る舞いである「ダイクォーク相関」の解明を目 指し、チャームバリオンの分光実験(E50実験[3])が提案され、その実現に向けた研究活動が行われて いる。2 つのクォークの相関であるダイクォーク相関は長年議論されているが、その存在は明らかに なっていない。バリオンを構成している 3 つのクォークの 1 つを重いチャームクォークに置き換え ることで、バリオンの残り 2 つのクォークの運動が分離し、励起状態に軽い 2 つのクォークの運動 であるダイクォーク相関を反映した状態が現れると考えられている。20 GeV/c の大強度π⁻ビームを 用いた $\pi^- p \rightarrow Y_c^{*+} D^*$ 反応によってチャームバリオンの励起状態(Y_c^{*+})を生成し、欠損質量法で生成 断面積を測定する。図 1(左)に示す MARQ スペクトロメータによって、 D^* -崩壊からの終状態の粒子



図1: MARQスペクトロメータ(左)。チャームバリオン質量スペクトル(予想)(右)。



図2: π20のレイアウトと分岐部のクローズアップ。

の運動量測定と粒子識別を行い Y_c^{*+}の質量スペクトルを得る。生成断面積は生成する Y_c^{*+}の内部構 造(スピン・パリティ状態)に依存し、図 1(右)のスペクトルに示されるようにダイクォーク相関を反 映して、基底状態のΛ_c⁺と励起状態の生成率が顕著に異なると予想されている。E50 実験によって、 生成反応によるユニークなアプローチからバリオン内部のダイクォーク相関の解明を目指す。

2. 高運動量二次粒子ビームライン: π20

2020年初頭に完成した高運動量ビームライン(High-p)は、既存の一次陽子ビームライン(A ライン) から一次陽子ビームのごく一部を取り出して、直接使用する形で運転されている。High-p は、A ラ インからの分岐点に生成標的を設置することで、二次粒子ビームを供給できるようにデザインされ いる。この二次粒子化した High-p ビームラインを「π20」と呼ぶ。図2はπ20の全体のレイアウトと 分岐部をクローズアップしたものである。生成標的におけるビームロス量は最大 15 kW を計画して おり、現在のT1標的と同様なHeガスを循環させた容器に標的システムをインストールする。二次 粒子の生成においては、ビームスウィンガー磁石を用いて粒子の生成量が最大となる 0 度の取り出 し角度でπ20 ビームラインに供給するように最適化されている。期待されるビーム強度はπ[±]中間子 や陽子において数 10 M/spill (spill: 2.0 秒間の取り出し)である。ビームラインには粒子分別機能が無 いため、ビームには多数のπ-に K-中間子や反陽子が 1-2%の割合いで混在する。実験ではこれらの 二次粒子を粒子識別検出器によって識別して、異なるビーム粒子を利用した実験も行うことができ る。二次粒子ビームは、π20ビームラインの四重極電磁石の最初のダブレットで収集された後、生成 標的の 50m 下流に設置されたコリメーターで収束することで、生成標的でのビームイメージを再定 義する。コリメーターの後、ビームは再び大きな分散を持つ焦点面(IF)に集束される。このとき、ビ ームライン磁石によって主要な幾何学収差と色収差は2次のオーダーまで除去/最小化される。IFに おけるビーム粒子の運動量(分散 dp/p)と水平位置(x)の相関から、二次ビームの運動量を測定できる ようにデザインされており、ビーム粒子を空間分解能1 mm(σ)で測定することで、0.1%(σ)の運動量



図3: π20建設のステージング案。

分解能が得られる。二次粒子ビームは実験標的位置(FF)に輸送され、FF におけるビームの水平分布 と垂直分布、およびビームライン方向に対する入射角分布は、シミュレーションからそれぞれ位置 分布で約 20 mm(σ)、角度分布で約 10 mrad(σ)と見積もられている。

このπ20 実現に向けたステージング案が計画されている。ステージング案では、標的におけるビー ムロス量を増やしながら、プロポーザルが提案されているいくつかの実験を順に遂行し、最終的に フルのπ20 ビームラインを実現して E50 実験を実施する計画である。3 つのステージが計画され、そ れらは、(1) 現状のビームライン構成要素と遮蔽体を変更無しに二次粒子ビームを取り出すフェーズ 1、(2) 数 kW の低ロス標的とビームスウィンガー磁石を導入して大強度二次粒子ビームの利用を目 指すフェーズ 2、(3) 15 kW の生成標的と遮蔽体を完備して、E50 実験を実施するフェーズ 3、であ る。図 3 は、このステージング案と、各ステージにおけるビーム強度と実施実験をまとめたもので ある。各ステージにおけるビームラインの性能や装置は、全体の目標であるハドロンの内部構造の 解明を目指す実験が各ステージにおいて実施可能となるように設定している。

3. T106 テスト実験

現在の High-p ビームラインは、A ラインとの分岐部に設置したランバートソン電磁石(LM 磁石) によって 30 GeV の一次陽子ビームの一部を図 4 に示す取り出し方法で切り出してユーザーへ供給 している。この運転では数百ワットの一次陽子ビームが LM 磁石の取り出し部分に衝突するため、 LM 磁石でのビームロスで二次粒子が生成されることが予想される。一次陽子ビームの取り出しで は LM 磁石のギャップに磁場をかけることで、High-p ビームラインへ陽子ビームを輸送する。一方 で、この LM 磁石の電場をオフにすることで、衝突している一部の一次陽子ビームから生成した二 次粒子のみを High-p ビームラインに送ることができる(図 4)。今回、LM 磁石において生成された二 次粒子を High-p ビームラインを通して測定する T106 テスト実験[4]が提案され、2025 年 1 月のビ ームタイム(Run 92)において二次粒子の測定が初めて行われた。この測定は前節で説明したπ20 のス テージング案におけるフェーズ 1 の最初のステップとなる。現在はビームライン磁石電源に転極器 が無いため、実験では正電荷粒子のみの測定を行った。測定を行った運動量は 3,5,10 GeV/c である。



図4: T106実験における二次粒子の生成と取り出し方法。

LM 磁石でのビームロス量の算出には、LM 磁石周辺のロスモニターの較正が必要である。ビーム ロス量の算出精度を上げるために、Run 92 のビームタイムの初期に 5 kW の加速器運転をリクエス トして行った。低強度ビームを利用することで、許容ビームロス量の範囲内でより一次陽子ビーム を LM 磁石に近づけることでき、一次陽子ビームのプロファイルモニターで測定が可能なビームの

芯に近い部分が LM 磁石に当たり、ビームのうち何%が ロスしたかが分かる(図 5)。この時、ビームの分布をガウ ス分布と仮定して計算すると、例えば 5 kW の際に 2o部 分(全体の 2.5%に相当)が当たると推定ビームロス量が 125 W、1.6o部分(全体の 5%に相当)だと 250 W の推定ビ ームロス量となる。このような手法で、一次陽子ビームの 位置を微調しながらロスモニターの応答を測定し、ロス モニターの計数率とビームロス量の対応関係を求めて推 定ビームロス量を算出した。T106 実験では、ビームロス 量の算出に用いるプロファイルモニターの位置情報とロ スモニターの計数率のデータを系統的に取得した。今後、 このデータを使用して詳細に解析する予定である。その 後 T106 実験の測定は、83 kW 運転におけるロスモニター の値と較正で得られたビームロス量との対応関係を使っ て算出した約 230W の推定ビームロス量で実施した。



図5: ロスモニターの較正方法。

図6はHigh-p最下流の磁石の下流に設置したT106実験セットアップの写真である。十分な時間 分解能を得るために蛍光板(シンチレーター)の両端に光電子増倍管を取り付けたT1とT2のいわゆ るタイミング検出器を設置し、T1とT2が同時に粒子を検出する事象の単位時間当たりの数を二次 粒子の計数率とした。T1とT2の間にはф0.5 mmのシンチレーションファイバー(蛍光を発するファ イバー)レイヤー3層(X:0°,UV:±30°)で構成されるファイバー飛跡検出器(BFT1,2)を2台設置して 飛跡を検出して、二次粒子の分布を測定した。T2の下流には粒子識別検出器(リングイメージングチ ェレンコフ検出器)を設置し、粒子識別のための分解能を向上するためのファイバー飛跡検出器 (BFT3)がその下流にある。屈折率 1.007の特殊な物質(エアロゲル)を用いた検出器)閾値型エアロゲ ル検出器)も粒子識別の性能向上のために設置した。µ粒子測定用の検出器として、それぞれ 100 mm



図6: T106実験セットアップの写真。

厚の鉄ブロックを間に置いた4枚の蛍光板によるタイミング検出器(T3-T6)を設置した。これはミューオンの透過力が大きいことを利用したミューオン弁別検出器である。実験エリアの最下流となる ビームダンプの直前にもタイミング検出器(T7)を設置し、長尺の飛行時間測定も行った。信号の読み 出しには、2024年6月にJ-PARCハドロン実験施設において実施したT103テスト実験[5]によって 確立した連続読み出しデータ収集システムを用いた。

実験では、ビームラインを構成する 20 台の磁石の磁場設定のチューニングを行い、取り出される 二次粒子の計数率が最大となるように調整した。調整後に得られた二次粒子の計数率を表1に示す。 図 7(左)は 5 GeV/c の運動量設定で得られた実験標的位置(FF)における二次粒子の水平(x)、垂直(y)方 向の分布と、それられの角度分布(dx/dz, dy/dz)である。FF における水平分布と垂直分布、およびビー ムライン方向に対する入射角分布は、それぞれ位置分布で約 10 mm(σ)、角度分布で約 4 mrad(σ)であ った。図 7(右)はリングイメージングチェレンコフ検出器で得られたビーム粒子のチェレンコフリン グイメージである。10 GeV/c 設定で、陽子のリングイメージが鮮明に観測できた。π⁺のリングイメ

運動量 [GeV/c]	3	5		10	
計数率 [M/spill]	0.2	0.6		1.4	
5000 X y y y y y y y y	2000 2000 1500 1000	3 GeV/c 160 140 140 140 120 100 120 100 100 100 100 10	5 GeV/	c 220 220 220 220 20 20 20 20 20	10 GeV/c 700 700 700 700 700 700 700 70

表 1: ビームライン調整後に得られた各運動量設定での二次粒子の計数率。

図7: FFにおけるプロファイル(左)。 リングイメージングチェレンコフ検出器で得られたリン グイメージ。5 GeV/cのK⁺と10 GeV/cの陽子のリングはほぼ同じ位置となる (右)。



図8: Muon filterの応答。(左) 5 GeV/cのπ20モードでの実測データとシミュレーションとの 比較。(右) 60%のµ20モード(3 GeV/cの運動量)におけるデータ。

ージはヒットパターンの右端に位置するように検出面を設置している。K⁺の混入量は 3 GeV/c では 約 1/1000、5 GeV/c と 10 GeV/c では 1/100 と見積もられるため、単純なヒットパターンでは信号が ノイズに埋もれてしまう(S/N が悪い)ため、リングイメージを観測することが困難であると考えられ る。今後、"Global approach"[6]と呼ばれる解析方法を用いて K⁺の比率を求める予定である。閾値型 エアロゲル検出器を用いた実験中のオンライン解析ではπ⁺中間子と陽子の比率は約 1:1 であった。実 験では、ビームラインの性能に関わる測定の他に、オペレーションに関するものとして、A ライン との同時運転が問題無く実施できたことや LM 磁石におけるビームロスの安定性を確認できた。

4. μ粒子測定実験

T106 テスト実験においては、二次粒子測定で調整したビームライン磁石の設定パラメータ(π20 モ ード)を元に、二次粒子であるπ中間子が崩壊して得られる三次ミューオン(μ粒子)を取り出す運転モ ード(μ20 モード)の試験も実施した。μ20 モードは図2 に示すコリメーターの前後の領域を崩壊ボリ ュームとして使い、コリメーターから上流部の磁石の運動量設定に対して、下流部の磁石を 60%~ 85%の低い値に設定変更する。このようにすることで、二次π中間子が崩壊する際に重心系で後方に 出る三次μ粒子を集めてくることができ、かつ元の二次π中間子をスイープすることで、高純度のμ粒 子を取り出せる。例えば、上流部の運動量設定に対して、下流部を 60%の値に設定することは、重 心系で後方180度方向に出るµ粒子を集めてくることに対応する。このµ20モードが実際に上手く 動作するか否かを検証した。実験では、3,5,10 GeV/cのそれぞれの運動量に対して、60%,75%,80%, 85%の計 4 つの下流部の磁石の設定変更を試験した。図 8 は、5 GeV/c 設定でのπ20 モードと、μ20 モードにおいて下流部を 60%に設定したときの、ミューオン弁別検出器の応答を示している。T3(0 mmの位置)での係数を1に規格化して、下流の厚さ各100mmの鉄ブロックを通過した粒子の減衰 の割合を示している。π20モードでは鉄が厚くなるにつれて二次粒子が減衰する様子が観測できる が、60%のμ20 モードにおいてはほぼ減衰していない。π20 モードのデータ点にはシミュレーション の結果を載せており、減衰の傾向はほぼ再現できている。5 GeV/c における各山20 モードのデータと シミュレーションを用いて求めたμ粒子の純度とそれ以外の二次粒子の混入率を図9に示す。80%以 下の設定において純度 90%以上が得られており、60%では約 99%の純度であることが分かった。測 定で得られた三次µ粒子の計数率を表2に示す。



[k/spill]	π20 モード	60%モード	75%モード	80%モード	85%モード
3 GeV/ <i>c</i>	200	0.42	0.64	1.0	2.0
5 GeV/ <i>c</i>	600	1.7	2.6	3.7	8.3
10 GeV/ <i>c</i>	1400	2.4	4.6	6.6	17.0

表 2: ビームライン調整後に得られた各μ20 モードでの粒子の計数率。

5. まとめと今後の展望

High-p ビームラインにおいて分岐部の LM 磁石で生成される二次粒子を測定するテスト実験 (T106) では、2025 年 1 月のビームタイムにおいて二次粒子の測定に初めて成功した。実験で得ら れたビームロスの情報や、実際に取り出された二次粒子の計数率やプロファイル、粒子の種類の割 合等を精査し、今後のπ20 へのアップグレード計画をより着実なものにしていく予定である。加え て、三次μ粒子を取り出す運転モードの試験も実施し、高純度の高運動量μ粒子の取り出しにも成功 し、J-PARC における新たな高運動量のμ粒子源を開拓した。2026 年度の後半までに転極器の設置[7] が完了するため、次回は負電荷二次粒子の測定実験が提案される計画である。加えて、μ粒子につい ては、比較的大きな物体(コンクリート内部に鉄骨が入っているもの)などを利用したイメージング実 験の計画を立案している段階であり、今後のビームタイムにおいて実証試験が提案される計画であ る。T106 実験において最初の二次粒子測定が完遂でき、π20 の建設と今後のハドロンの内部構造の 解明を目指す実験の実施に対しての大きなステップとなったと言えよう。

Reference

- [1] A. Hosaka et al., "Exotic hadrons with heavy flavors: X,Y,Z and related states", PTEP 2016, 062C0 (2016).
- [2] S. K. Choi et al., Phys. Rev. Lett. 91, 262001 (2003)., R. Aaij et al., Phys. Rev. Lett. 121, 162002 (2018).
- [3] H. Noumi *et al.*, J-PARC Proposal E50, "Charmed Baryon Spectroscopy via the (π, D^{*-}) reaction" (2012).
- [4] K. Shirotori et al., J-PARC proposal T106, "Proposal for the first stage of the P93 experiment (Evaluation of the performance of the secondary beam at the high-momentum beam line)" (2024).
- [5] K. Shirotori *et al.*, J-PARC proposal T103, "Proposal for a test experiment to evaluate the performance of the trigger-less data-streaming type data acquisition system" (2024).
- [6] R. W. Forty and O. Schneider, "RICH pattern recognition," CERN, Geneva, Tech. Rep., 1998. [Online]. Available: https://cds.cern.ch/record/684714 (cit. on pp. 66, 69).
- [7] JST K-program (JPMJKP24J3)